



CENTRO UNIVERSITÁRIO CTC

DEPARTAMENTO Programa de Pós-graduação em Metrologia

---

## MQI2002 Fundamentos da Tecnologia Industrial Básica

CARGA HORÁRIA TOTAL: 45 HORAS (3-0-0)

CRÉDITOS: 3

**OBJETIVOS** XXXXXXXX

**EMENTA** Fundamentos e conceitos básicos de C&T. Fundamentos da tecnologia industrial (metrologia, normalização, regulamentação técnica, certificação, credenciamento, avaliação da conformidade, propriedade intelectual e industrial e técnicas de gestão). A Estrutura das Organizações de C&T no Brasil e a estrutura das organizações internacionais atuantes em metrologia e áreas afins. A certificação ISO 9000 (Sistema da Qualidade). A Certificação 14000 (Meio Ambiente). Normalização voluntária e regulamentação técnica (normalização compulsória). Fundamentos da Transferência de Tecnologia. Avaliação Tecnológica na Empresa. Propriedade Intelectual (Marcas e Patentes).

**PROGRAMA** XXXX

**AValiação** XXXX

**BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL**

- [1] Gerenciamento da tecnologia, Eduardo Vasconcellos, Edgar Blucher, São Paulo, 1995.
- [2] From lab to market, S.K. Kassiech, H.R. Radosevich et al., Plenum Press, New York, 1993.
- [3] "Tecnologia: aquisição, desenvolvimento, proteção, transferência e comercialização", R. Fernandes, IEL, Rio de Janeiro, 1998.
- [4] Acesso à Informação: estratégia para a competitividade", ISBN 85-7013-054-6, Frota M.N. & Frota M.H., editado pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, 1994.
- [5] Luciano Coutinho e João Carlos Ferraz, O estudo da competitividade da Indústria brasileira, Editora Universidade de Campinas, 510p., 1994.

[6] Maristela Afonso de A. Sannt'Ána, João Carlos Ferraz e Isaac Kerstemetzky, José Reis (Editor), desempenho industrial e tecnológico brasileiro, Coleção Estudos de Política de Tecnologia Industrial Básica, Editora UNB, 277 p.1990.

[7] Sites diversos de organizações internacionais de metrologia, avaliação da conformidade, acessíveis via: [Home Metrology web-citation-index](#).

**BIBLIOGRAFIA**      XXXX

**COMPLEMENTAR**